

La photodétection avec les semi-conducteurs



ID de Contribution: 20

Type: Non spécifié

Advanced synchrotron radiation based techniques (Bragg diffraction imaging, XBIC) for the characterization of semiconductors used for detection

mardi 4 juin 2024 12:40 (20 minutes)

Orateur: BARUCHEL, J.

Classification de Session: Session 4. Detectors for synchrotron radiation